

LVCompact - Technische Daten



Systemvarianten

Standalone-System LVC
Bildauswertung mit Progressive Scan, Auflösung 20 µm (SMD),
flexible Baugruppenaufnahme

Systemkomponenten, Hardware

Bildverarbeitungsrechner im System
Pentium mit Betriebssystem Windows 2000, Bildverarbeitungskarte
Matrox, Ethernetkarte, ISDN/Modem für Fernwartung
LCD-Monitor 17"

XY-Einheit

Arbeitsbereich 200mm x 300mm
Vergrößerter Bereich 250mm x 350mm

Baugruppenhöhe

Oben: max. 45 mm
Unten: max. 45 mm

Kleinstes zumessendes Bauteil

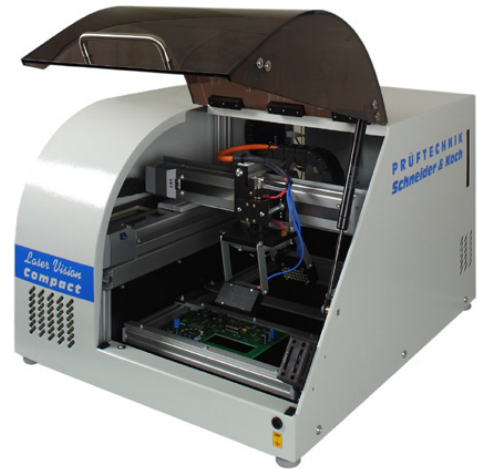
0402 0,65 pitch
alternativ 0201 0,35 pitch

Prüfgeschwindigkeit

Abhängig von Boarddesign und Konfiguration:
Typisch 50.000 Bauteile/h

Allgemeine Daten

Elektr. Anschluß	230 V / 3A
Zertifizierung	CE (EU-Normen, Maschinenrichtlinien inkl. EMC etc.)
Abmessungen in mm	510 x 610 x 380 (B x L x H)
Gewicht	ca. 50 kg
Temperatur, in Betrieb	10°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit, in Betrieb	<80%, nicht kondensierend



Software

Standardprüfroutinen Bildverarbeitung

Prüfung von Bauteilen mit Bestückungswinkel
0-360°
Prüfung der Anwesenheit und Polarität von THT- und SMT
Bauteilen
Prüfung der Bauteillage (Versatz, Winkel)
Lötstellenprüfung an SMT- und THT-Bauteilen
Lötstellenprüfung an ICs
Kurzschlussstest (Lötbrücken)
Lötpastentest (2-D)

Produktionswerkzeuge, Dokumentation der Ergebnisse

Automatische Speicherung der Prüfergebnisse
Benutzerdefinierte Ergebnismitteilungen
CAD-Datenkonvertierung (LVCad) in Quelltextformat
Prüfergebnisausgabe (konfigurierbares ASCII-Format),
Transfer an externes QMS
Fehlerstatistik, Yieldmeter, SPC (LVStat)
Graphische Reparaturstation (LVRepair)
Graphische Baugruppenansicht (LVBoard)
Offline-Seriendebug
Remote Service / Debuggen via Modem / ISDN
Barcodelesen mit Kamera
Optische Charakterverifikation (OCV) an Bauteilen

Optionen

Offline Programmierung, Remote Station
Weitere Lizenzen für LVRepair, LVBoard, LVStat

Programmerstellung

Automatische Programmerstellung aus Library mit CAD-Daten
CAD-Overlay, automatisches Change-Management von
Bestückungsvarianten
Automatische Kamera- und Wegeoptimierung
Automatische Generierung von Nutzentests
Array-Test zur einfachen Vervielfältigung gleicher Einzeltests
Automatische Generierung von Programmen für den
Erstmustertest (Vergleich mit abgelernter Baugruppe z.B.
Rüstprüfung für Bestückssysteme)
Alternativtests für Bauteilvarianten
Unterstützung von Bestückungsvarianten (bis zu 255)
Ausgabe selbst definierter PASS / FAIL-Meldungen

